

ICR E150 set 近场微电场探头组



描述：

ICR E150 set 近场微探头是为高分辨率测量近场电场而设计的。使用 ICR E 探头可进行以下测量：1，根据 IEC 61967-3，通过 IC 进行表面扫描。2，通过 IC 进行体积扫描。3，探头的测量电极水平的对准测量表面进行引脚扫描。前置放大器集成在探头外壳中，由 T 型偏置供电。ICR 近场探头在交付前经过质量检查。执行不同的参考设置测量，并生成相应的校正线。确定了两条不同的校正线：标准化校正线和电场校正线。

ICR E150 set 包含以下附件：

- ICR E150, 近场微电场探头 (7MHz ~ 3GHz)
- BT 706, T 型偏置器
- SMA-SMA RA, 测试电缆

具体指标：

频率范围	7 MHz ~ 3 GHz
分辨率	65 μm
电极面积	(150 x 35) μm

ICR E150 set 各部分说明：

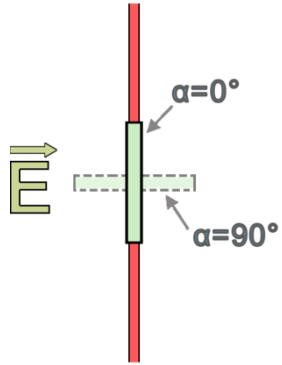
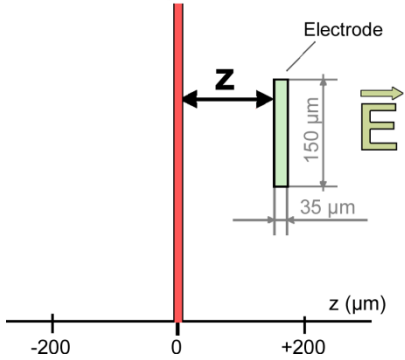
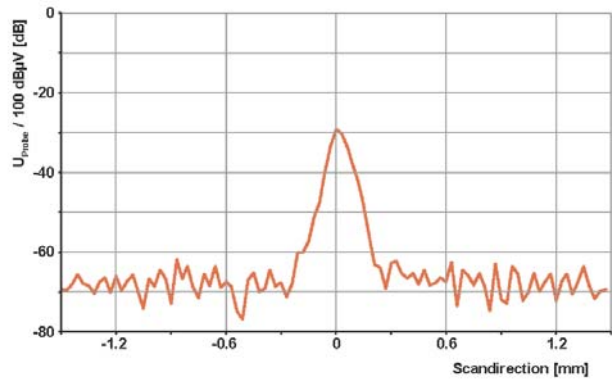
1. ICR E150 近场微电场探头 (7MHz~3GHz)

该探头以很高的分辨率和敏感性来测量电场。距离被测物小于 1mm 时效果最佳。由于探头的尺寸非常小，它必须借助人工或自动定位系统（例如，Langer-扫描仪）来移动。该探头屏蔽磁场耦合。前置放大器集成在探头外壳中，探头外壳由 BT 706 T 型偏置供电。外壳上的调整螺钉允许将探针尖端手动对准探针外壳。探头支持 Langer 扫描仪的碰撞保护功能，在垂直移动过程中，如果触摸到被测设备，将停止移动。



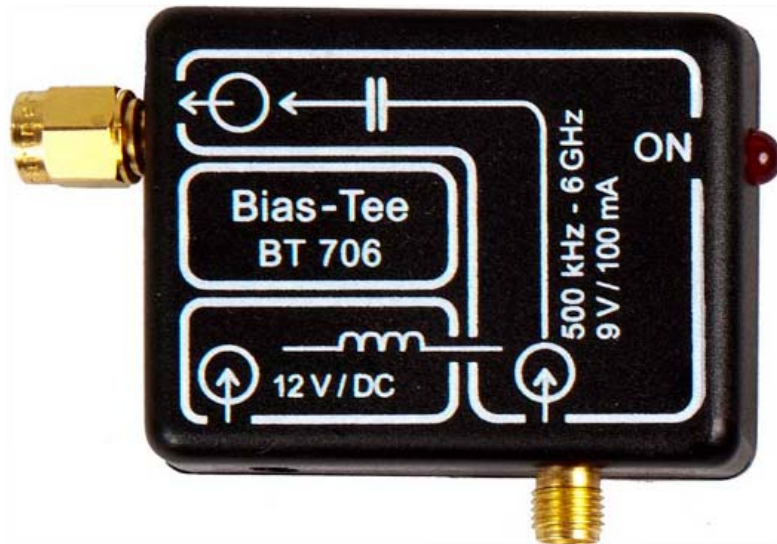
具体指标：

频率范围	7 MHz~3 GHz
分辨率	65 μm
电极面积	(150 x 35) μm
频率特性	<p>Frequency respons ICR E150 @ Stripline width 20μm, distance 20μm</p>
测量原理	

<p>设计视图 1</p>	<p style="text-align: center;">Stripline</p>  <p style="text-align: center;">$f, \alpha \dots \text{variable}$</p>
<p>设计视图 2</p>	<p style="text-align: center;">Stripline</p>  <p style="text-align: center;">z (μm)</p>
<p>横截面</p>	

2. BT 706 T型偏置器

该偏置器用于为前置放大器供电。前置放大器的供电端是其输出端口，同时不影响放大器输出端传递的测量信号。T型偏置器通过前置放大器的射频测量导线连接到频谱分析仪或者示波器的输入端口。偏置器的电源由一个电源适配器提供。



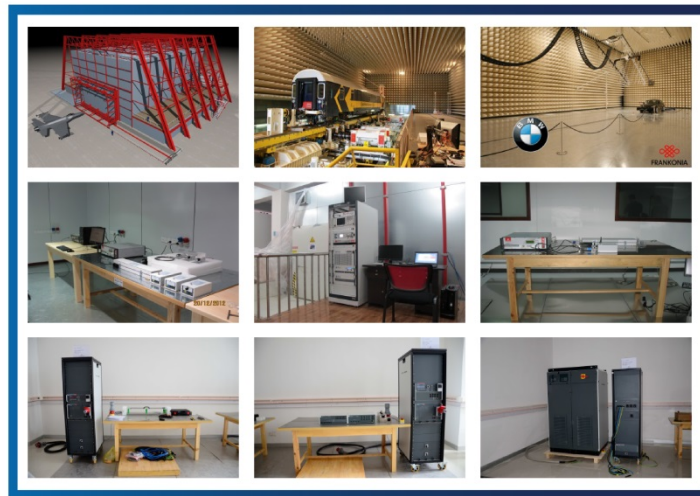
具体指标：

频率范围	500 kHz - 6 GHz
电源电压	12 V / 70 mA
接口	SMA
尺寸 (L x W x H)	(50 x 38 x 13) mm

北京世纪汇泽科技有限公司



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn